

## TOF-SIMS M6 の性能および測定事例紹介

○江口 奈緒

大阪大学 コアファシリティ機構

### 1. TOF-SIMS M6 について

TOF-SIMS M6 は IONTOF 社製最新の TOF-SIMS である。最新型の Bi クラスタリーオン銃 Nanoprobe 50 を搭載しており、微小領域のイメージングから深さ方向分析まで無機・有機問わず幅広いアプリケーションに対応することができる。大阪大学では産業科学研究所に 2019 年に導入され、全学共用機器として運用されていることから、産業科学研究所のみならず幅広い部局のユーザーに対応している。本発表では TOF-SIMS M6 の性能および測定事例を紹介する。

### 2. 本学の TOF-SIMS M6 の仕様・性能について

産業科学研究所に設置の TOF-SIMS は一次イオン銃としての Bi クラスタリーオン銃の他に、スパッタ銃として酸素、セシウムイオン銃、Ar ガスクラスタリーオン銃を搭載している。また、アナライザーに EDR を搭載していることにより広いダイナミックレンジの測定が可能である。

本装置を使用した測定事例として、MS スペクトル測定、イメージング、デプスプロファイルなどを紹介する。

